

第3章

電力，電磁波から暗号回路の内部動作を解析する

DES 暗号回路を実測し，差分電力解析を行う

高橋芳夫，佐藤 証

ここでは，実際に暗号 LSI からデータを収集し，どのようにして秘密かぎが抽出されるかを解説する。筆者らは，FPGA に DES (Data Encryption Standard) 暗号回路を実装し，差分電力解析 (DPA) を行った。その結果，数千サンプルのデータから，秘密かぎ全 56 ビットを取り出せることがわかった。なお，今回の実験は使用した FPGA 固有の性質によるものではなく，LSI が動作する際の消費電力の変動や電磁波の放射など，一般的な現象を利用している。(編集部)

筆者らは，実際に DES 暗号回路を動作させて消費電力と電磁波の観察を行い，LSI の漏えい情報を解析して秘密かぎを取り出す実験を行いました。ここでは，電力や電磁波の測定がどのように行われるのか，また測定波形からどのようなことが分析できるのかを解説します。

サイドチャンネル攻撃(正規の入出力経路以外からの情

報を利用した攻撃)の評価用として，耐タンパ性(攻撃に対して，秘密情報の守秘や機能の改変を困難にする性質)に関する標準化のための調査・研究を行っている INSTAC (Information Technology Reseach and Standardization Center)などが専用評価ボードを開発しています。こうした評価ボードには，高性能な電源回路やコンデンサ(OSCON や POSCAP など)を使ってノイズを抑えたり，電力(電流)測定用にシャント抵抗を実装して精密に測定できるようにくふうされたものがありますが，非常に高価なうえに入手も困難です。

DES 程度の小さな暗号回路で簡単な実験を行うには，このような専用ボードよりも，シンプルな構成の FPGA ボードが適しています。そこで，今回の実験では本誌 2005 年 1 月号付属の FPGA 基板を利用しました。なお，この実験は FPGA (XC3S50) に固有の機能や性質に依存したものではありません。

3



図1 実験環境
図に，今回の実験のために行った FPGA 基板の改造内容と測定環境をまとめる。

